

高分辨率平场远紫外光谱仪

highLIGHT

SXR

XUV



产品特点

最高光谱分辨率

- 1-100nm光谱范围的平场光谱仪
- 一流的光谱分辨率与用户友好型的平场配置相结合
- 极高的光谱分辨率、宽光谱覆盖范围和优异的信噪比的独特组合

最高的效率

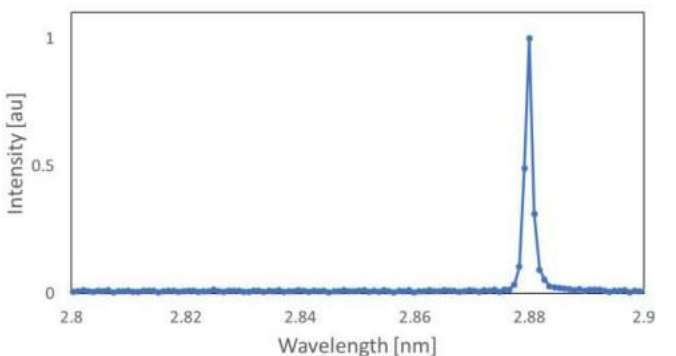
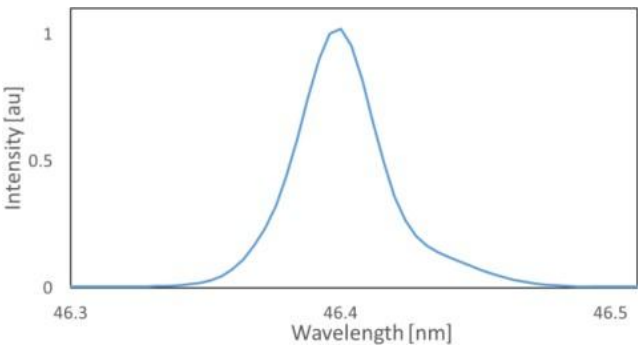
- 无狭缝设计：不使用对准敏感的窄入口狭缝
- 与标准光谱仪相比，光收集量增加约20倍，从而使信噪比成比例提高

准确 高效

- 绝对光栅位置监控，用于保持光栅对齐
- 高效率像差校正平场光栅
- 软件控制方便

定制化服务

- 每台光谱仪都是按订单要求生产



高谐波源的高分辨率光谱。倍频1um波长光纤激光器在氩气中产生第11次谐波，并用铝箔过滤。FWHM 为 5.7 像素的 CCD 相机（13um 像素大小），因此分辨率为 1340。(数据由德国夫琅和费应用光学精密工程研究所J. Rothhardt博士提供)

使用 highlight SXR + 时2.88nm 处氮谱线的发射光谱测量（430eV，跃迁 1s2-1s2p）。 FWHM 为 1.7 像素的 CCD 相机（13um 像素大小），因此分辨率为 1890。探测器的极限分辨率为3290。（数据由Göttingen激光实验室的K.Mann博士提供）

规格

• 系统	像差校正平场光谱仪
• 波长范围	1-100nm
• 光源距离	可变
• 探测器	CCD 或 MCP/CMOS
• 真空压强	<10 ⁻⁶ mbar（提供超高压版本）
• 无狭缝技术	是
• 入口狭缝	可选
• 光栅调节方式	电动闭环
• 光谱滤波器插入选项	是
• 控制接口	USB 或 以太网
• 软件	Windows UI和Labview/VB/C/C++ SDK
• 客户定制服务	可定制
• 其他	非磁性，尺寸定制等

	SXR+	XUV	VUV
波长范围	1-5 nm	1-20nm	5-100nm
色散	0.06nm/mm	0.1-0.2nm/mm	0.2-0.7nm/mm
分辨率	<0.001nm @3nm	<0.005nm@10nm	<0.02nm@60nm